

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոն

Տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն

Պրոֆեսոր

## 📖 Հրատարակումներ

Հոդված

### Memory Physical Aware Multi-Level Fault Diagnosis Flow

SAMVEL SHOUKOURIAN, GURGEN HARUTYUNYAN, SUREN MARTIROSYAN, YERVANT ZORIAN

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 2020 700-711

Հոդված

### Fault Awareness for Memory BIST Architecture Shaped by Multidimensional Prediction

#### Mechanism

S. Shoukourian, G. Harutyunyan, Y. Zorian

IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems 2019 562-575

Հոդված

### Experimental study on Hamming and Hsiao Codes in the Context of Embedded Applications

S. Shoukourian, G. Harutyunyan, G. Tshagharyan, Y. Zorian

IEEE East-West Design & Test Symposium 2017 25-28

Հոդված

### Automated Flow for Test Pattern Creation for IPs in SoC

S. Shoukourian, G. Harutyunyan, D. Sargsyan, Y. Zorian

IEEE East-West Design & Test Symposium 2017 21-24

Հոդված

### An Efficient Testing Methodology for Embedded Flash Memories

S. Shoukourian, G. Harutyunyan, S. Martirosyan, Y. Zorian

IEEE East-West Design & Test Symposium 2017 422-425

Հոդված

### Security Issues in Test and Repair Infrastructure for Systems-on-Chip

S. Shoukourian, G. Harutyunyan, G. Tshagharyan

Информационно-коммуникационные технологии в науке, производстве и образовании ICIT-2017  
2017 114-122

Գիտաժողովի կյուբ

### Extending fault periodicity table for testing faults in memories under 20nm.

Gurgen Harutyunyan, Samvel K. Shoukourian, Valery A. Vardanian, Yervant Zorian

Գիտաժողովի կյուբ

### A power based memory BIST grouping methodology.

Lusine Martirosyan, Gurgen Harutyunyan, Samvel K. Shoukourian, Yervant Zorian

Գիտաժողովի նյութ

**Overview study on fault modeling and test methodology development for FinFET-based memories.**

Grigor Tshagharyan, Gurgen Harutyunyan, Samvel K. Shoukourian, Yervant Zorian

---

Արտոնագիր

**Testing Electronic Memories Based on Fault and Test Algorithm Periodicity**

S. Shoukourian, G. Harutyunyan, V. Vardanian, A. Hakhumyan, Y. Zorian

---

Արտոնագիր

**FINFET-BASED MEMORY TESTING USING MULTIPLE READ OPERATIONS**

Samvel Shoukourian, Gurgen Harutyunyan, Grigor Tshagharyan, Yervant Zorian

---

Արտոնագիր

**DETECTION OF ADDRESS ERRORS IN MEMORY DEVICES USING MULTI-SEGMENT ERROR DETECTION CODES**

Samvel Shoukourian, Gurgen Harutyunyan, Hayk Grigoryan, Grigor Tshagharyan, Yervant Zorian

---